## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

58198825

**PUBLICATION DATE** 

18-11-83

APPLICATION DATE

14-05-82

APPLICATION NUMBER

57079996

APPLICANT:

HITACHI LTD;

**INVENTOR:** 

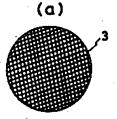
WATANABE NOBUKI;

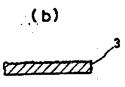
INT.CL.

H01J 29/02 // H01J 29/07

TITLE

**COLOR CATHODE-RAY TUBE** 





ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent emission slump by forming recesses and protrusions on the surface of an electron shield in a color cathode-ray tube with the electron shield.

CONSTITUTION: An electron beam 8 emitted from an electron gun 7 is radiated on an electron shield 3 except a shadow mask 1 and a phosphor. The electron beam radiated on the shield 3 is reflected and is radiated on internal graphite 5 applied onto a funnel cone section and the gas generates emission slump. A number of recesses and protrusions are formed on the surface of this electron shield 3 by abrading it with sand paper and the like. As a result, emission slump can be prevented, stable characteristics can be obtained, and reliability can be improved.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭58—198825

⑤Int. Cl.³H 01 J 29/02// H 01 J 29/07

識別記号

庁内整理番号 6680-5C 6680-5C 函公開 昭和58年(1983)11月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❸カラーブラウン管

@特

頁 昭57—79996

加藤収

修正

頭 昭57(1982)5月14日

砂発 明 者

茂原市早野3300番地株式会社日

立製作所茂原工場内

⑩発 明 者。渡辺薫樹

茂原市早野3300番地株式会社日

立製作所茂原工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

発明の名称 カラープラウン管

#### 特許請求の範囲

パネル、ファンネルから成るパルプの内部にシャドウマスク、インナーシールド、エレクトロンシールドを装着したカラープラウン管において、エレクトロンシールドの表面に凹凸を形成したことを特徴とするカラープラウン管。

#### 発明の詳細な説明

本発明はエレクトロンシールドを有するカラーブラウン管に係り、特に、実装ランニング中のエミツションスランプを防止出来るエレクトロンシールドに関するものである。

従来のエレクトロンシールドは第1図に示すように、カラープラウン管内部に装着されているもので一般的な形状としては第2図に示すようなものである。

図において、1 はシャドウマスク、2 はパネル、3 はエレクトロンシールド、4 はフアンネル、5 は内袋無鉛、6 は偏向ローク、7 は電子銃、8 は

電子ピームである。とのよりなエレクトロンシールド3は、通常材質としては加工性及びコストの点からアルミニウム(0.2~0.08 mmt)を使用している。そしてこのエレクトロンシールド3の扱面は平坦である。

この状態で強制ラスター大試験と呼んでいる実 装ランニング試験を行うと、エレクトロンシール ドが原因で時間経過とともにエミツションスラン ブするものが高率で発生する。

特に、カソード温度が低下するとその影響が更 に大きくなることがわかつた。

したがつて、本発明の目的は、エレクトロンシールドが超因する実装ランニング中のエミツションスランプを防止できるようなカラープラウン管を提供するものである。

強制ラスター大試験のエミッションスランプの 原因は要因分離実験の結果、パルブサイズ、電子 銃からのガス放出、試験条件(ヒータ電圧、測定 時間等)、エレクトロンシールドがその大きな要 因であることがわかつた。 本発明は特に影響の大きいエレクトロンシール ドにつき改良を目的としたものである。

3 w

生かクトロンシールドについては、エレクトロンシールドを装着したものとしないもので前配の強制ラスター大試験を行うと、エレクトロンシールドを有したものは高率でエミッションスランプを発生したが、エレクトロンシールドを装着しなかつたものは常にスランプ現象は発生したかつた。

通常、実装ランニング中のエミツションスランプの原因は、管内のガス(管内の真空度がもともと悪い場合と電子ピームが照射された時発生するものと2種類がある)によりエミツション源である遊離パリウム(Ba)が損失するためである。

エレクトロンシールドのガス放出源がどこにもるか調査したととろ、一つの要因として、エレクトロンシールド材自身が電子ピームを照射された時それ自体からガス放出するものと考え、エレクトロンシールドをペルブに装着する前に、400℃×15分の水素処理を行つたが、エミッションスランブを防止出来なかつた。

**-3-**

第3図にエミッションスランプを起した場合(1)と、起さない場合(1)のカソード電流経時変化を示す。エミッションスランプしない場合はカソード電流は時間経過しても一定の値を保つているが、エミッションスランプしたものはカソード電流が時間経過と共化減少して来る。

従来のエレクトロンシールドの表面は鏡面状態 を呈しており顕微鏡で拡大してもほとんど凹凸が 見られない。

このためエレクトロンシールドに照射された電子は非常に反射しやすく、それだけ内装黒鉛からのガス放出が多くなりエミッションスランプが発生しやすくなる。

この理由から、エレクトロンシールド3に照射された電子の反射量をできる限り少なくするため、本発明では第4図に示す如く、エレクトロンシールド3の表面をサンドペーパーで磨き、表面に多量の凹凸を形成する。なか、このような凹凸はエレクトロンシールド3の電子鉄に向う面に形成することになる。

一方、エレクトロンシールドを装着した中でもスランプしないものがあるので、スランプしたエレクトロンシールドとスランプしなかつたエレクトロンシールドの表面を定査型電子顕微鏡で比較したところ、スランプを生じなかつたエレクトロンシールドの表面が狙れている(凹凸がある)ととがわかつた。

この結果から、エミッションスランブの原因は、電子銃から放出された電子ピームがエレクトロンシールドに照射され、その電子が反射してフアンオルコーン部の内袋無鉛に照射されることにより内袋無鉛からのガス放出によるものと考えられる。

第1図に示したように、電子鉄7より放出された電子ピーム8はシャドウマスク1及びけい光体以外にエレクトロンシールド3に照射される。

そのエレクトロンシールド3に照射された電子 ピームは反射してフアンネルコーン部に強布され ている内装黒鉛5でに照射され、この内装黒鉛5か ら水(H<sub>2</sub>O)が放出されて、そのガスによりエミ ツションスランプするものである。

- 4 -

このことにより、カソード電流は第3図の向に 示すようになり、ほとんどエミッションスランプ が発生しなくなることがわかつた。

エレクトロンシールドに照射された電子を反射 しにくくする方法としては、前記の如く表面に模 械的に傷を付けて凹凸を付ける方法(更にサンド ブラストする方法も同様である)のほかに、化学 処理または酸化をして表面に酸化アルミニウム ( $A \ell_2 O_a$ ) 膜を作る方法が考えられる。

更に、アルミニウムの圧延ローラに凹凸を付け て圧延が完了した時に自動的に凹凸を付けること も考えられる。

このように、本発明は、エレクトロンシールド の表面を租面処理して、照射された電子ピームが より反射しにくくしたことである。

本発明によれば、エレクトロンシールドからの 反射電子を減少させることが出来るため、強制ラスター大試験不良を従来の数10%からほとんど ゼロにすることが出来るだけでなく、顧客でのエ ミンションスランプを無くすることが出来るので、 より安定した特性が得られ、信頼性が向上する効果がある。

### 図案の簡単な説明

第1図は通常のカラーブラウン管の構造図、第2図はエレクトロンシールドの新視図、第3図はカソード電流の時間変化特性図、第4図(a)は本発明によるエレクトロンシールドの部分拡大平面図、第4図(b)はその断面図である。

1・・・・シャドウマスク、2・・・・パネル、3・・・・エレクトロンシールド、4・・・・ファンネル、5・・・・内装黒鉛、6・・・・偏向ローク、7・・・・電子鉄、8・・・・電子ピー

代理人 弁理士 薄 田



